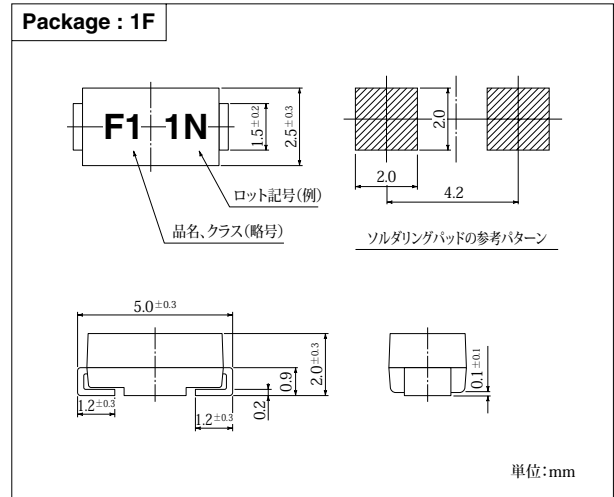


VR-61F1

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

定格表 RATINGS

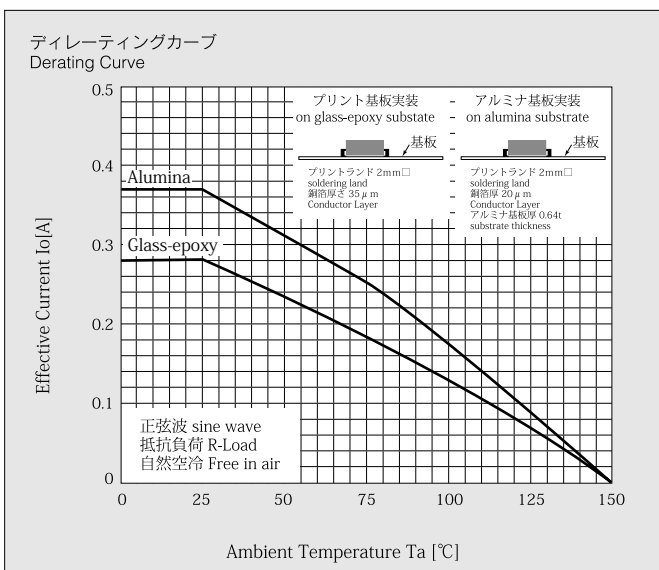
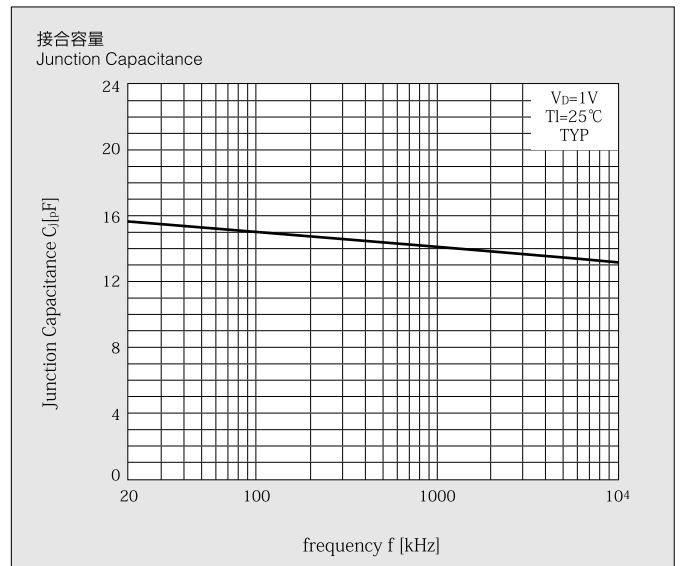
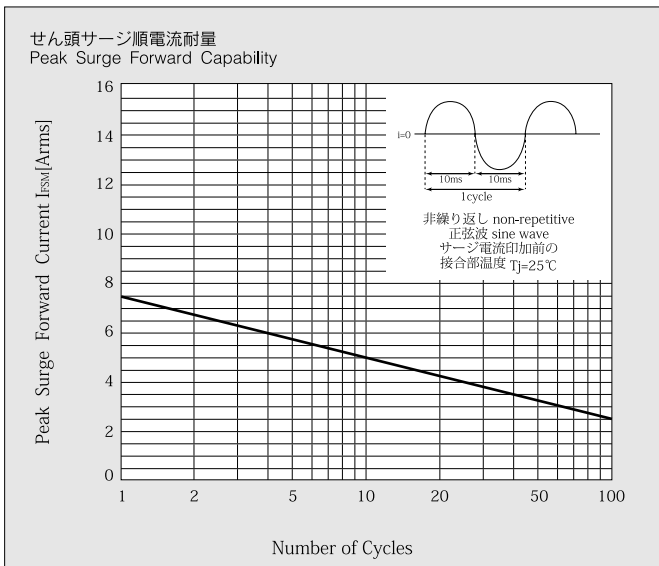
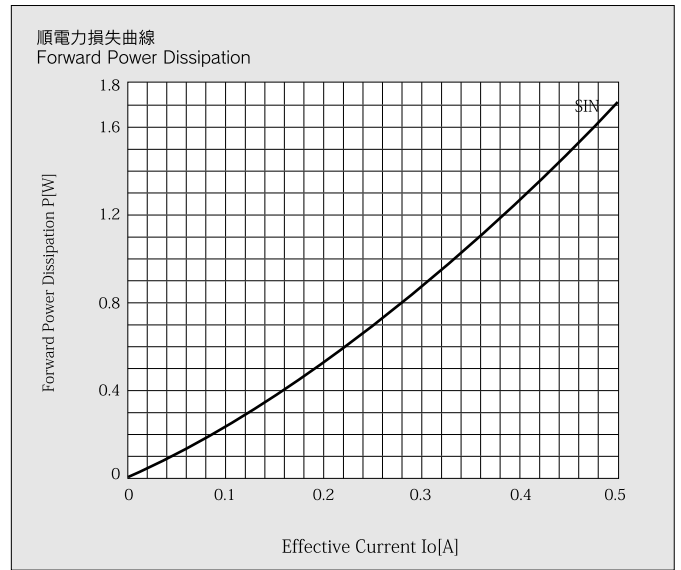
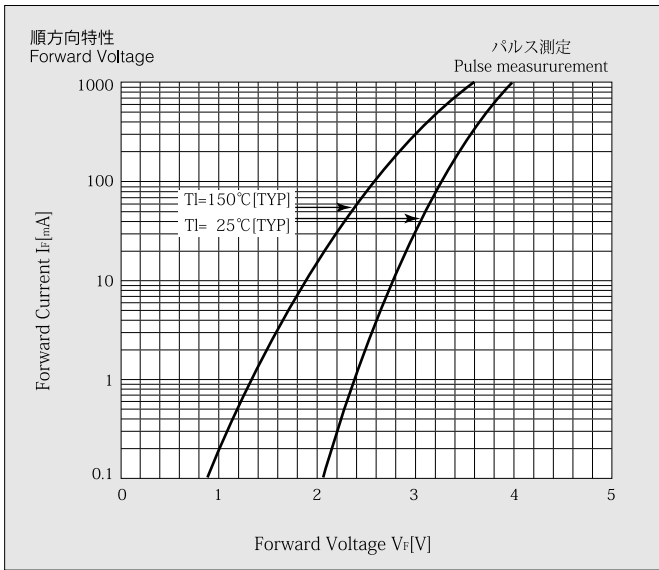
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | | 規格値 Ratings | 単位 Unit |
|---|--------------|---|--------------------------------------|----------------|------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -55~150 | °C |
| 接合部温度 Junction Temperature | Tj | | | 150 | °C |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | Io | Ta=25°C 正弦波 抵抗負荷, 50Hz Ta=25°C .sine wave, Resistance load, 50Hz | アルミナ基板実装 On alumina substrate | 0.37 | Arms |
| | | | プリント基板実装 On glass-epoxy substrate | 0.28 | |
| せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current | IFSM | 50Hz 正弦波 50Hz Sine wave | 非繰り返し Non-repetitive | 7.5 | Arms |
| | | 10/200 μ s | | 60 | A |
| | | 10/1000 μ s | | 30 | |

●電氣的・熱的特性 $T_1=25^\circ\text{C}$ Electrical Characteristics $T_1=25^\circ\text{C}$ (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|
| 順電圧 Forward Voltage | VF | IF=1mA パルス測定 Pulse measurement | MIN 2.05 MAX 2.55 | V | |
| | | IF=10mA パルス測定 Pulse measurement | MIN 2.50 MAX 3.00 | | |
| | | IF=70mA パルス測定 Pulse measurement | MIN 2.85 MAX 3.35 | | |
| 接合容量 Junction Capacitance | Cj | f=100kHz VD=1V OSC=50mVrms | TYP 15 | pF | |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ_{ja} | 接合部・周囲間 Junction to ambient | アルミナ基板実装 On alumina substrate | MAX 108 | °C / W |
| | | | プリント基板実装 On glass-epoxy substrate | MAX 157 | |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一
Typical は統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.